

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012年4月5日(05.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/043626 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 31/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/072178
- (22) 国際出願日: 2011年9月28日(28.09.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-216600 2010年9月28日(28.09.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三洋電機株式会社(SANYO Electric Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 井手 大輔 (IDE Daisuke) [JP/JP]; 〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号三洋電機株式会社内 Osaka (JP). 村上 洋平(MURAKAMI Youhei) [JP/JP]; 〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号三洋電機株式会社内 Osaka (JP). 森上 光章(MORIGAMI Mitsuaki) [JP/JP]; 〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号三洋電機株式会社内 Osaka (JP). 後藤 良(GOTO Ryo) [JP/JP];

〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号三洋電機株式会社内 Osaka (JP).

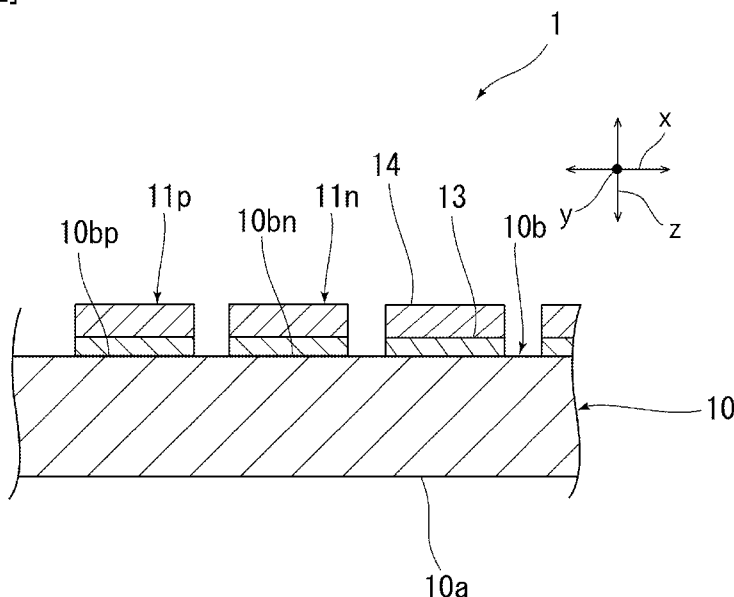
- (74) 代理人: ▲角▼谷 浩 (KADOYA Hiroshi); 〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号三洋電機株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING SOLAR CELLS

(54) 発明の名称: 太陽電池の製造方法

[図2]



(57) Abstract: [Problem] To provide a method for manufacturing solar cells, said method being capable of minimizing inter-solar-cell variability in electrode thickness. [Solution] A holder (20), to which a plurality of substrates (10) are affixed in a matrix pattern, and a plating electrode (21) are arranged in a plating bath (24) such that one principal surface (10b) of each substrate (10) faces the plating electrode (21). Then, with a masking member (22) arranged so as to cover at least a region outside the region where the substrates (10) are arranged, as seen from the plating-electrode (21) side in the direction in which the holder (20) and the plating electrode (21) face each other, a plating film (14) is formed between the holder (20) and the plating electrode (21).

(57) 要約: 【課題】太陽電池間での電極の厚みばらつきを抑制することができる太陽電池の製造方法を提供する。【解決手段】めっき浴24中において、複数の基体10がマトリクス状に固定されたホルダー20と、めっき用電極21と

を、複数の基体10のそれぞれの一の主面10bとめっき用電極21とが対向するように配置すると共に、ホルダー20とめっき用電極21との間に、ホルダー20とめっき用電極21との対向方向のめっき用電極21側から見た際に、少なくとも複数の基体10が配置されている領域の外側の領域を覆うように遮蔽部材22を配置した状態でめっき膜14を形成する。



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称： 太陽電池の製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、太陽電池の製造方法に関する。

背景技術

[0002] 近年、環境負荷の低いエネルギー源として太陽電池が注目されている。太陽電池は、基体に光が照射されることにより生じた電子及び正孔を電極により収集することにより、電気エネルギーを発生させる発電機構である。

[0003] 太陽電池の電極の形成方法としては、例えば下記の特許文献１に記載されているように、めっき法による電極の形成方法が知られている。具体的には、特許文献１には、太陽電池の電極の形成方法として、それぞれ、複数の開口がマトリクス状に形成されている支持フレームと補助フレームとでマトリクス状に配列された複数のウェーハを挟持した状態でめっき浴に浸漬し、補助フレームから給電することにより複数のウェーハ上に電極を形成する方法が記載されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献１：米国特許第 7 1 7 2 1 8 4 号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] しかしながら、特許文献１に記載の電極の形成方法では、支持フレームと補助フレームとに挟持された複数のウェーハ間で、形成される電極の厚みが大きくばらつくおそれがある。具体的には、複数のウェーハのうち、中央側に位置していたウェーハの上に形成された電極の厚みが相対的に薄くなり、周辺部に位置していたウェーハの上に形成された電極の厚みが相対的に厚くなる可能性がある。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明の一態様に係る太陽電池の製造方法は、めっき浴中において、複数の基体がマトリクス状に支持されたホルダーをめっき用電極に対向させて配置すると共に、前記ホルダーと前記めっき用電極との間に少なくとも前記複数の基体が配置されている領域の外側の領域を覆うように遮蔽部材を配置し、前記複数の基体上にめっき膜を形成する工程を備える。

発明の効果

[0007] 本発明によれば、太陽電池間での電極の厚みばらつきを抑制することができる太陽電池の製造方法を提供することができる。

図面の簡単な説明

[0008] [図1]本発明に係る一実施形態において製造する太陽電池の略図的平面図である。

[図2]図1の線I-Iにおける略図的断面図である。

[図3]本発明を実施した一実施形態においてめっき膜を形成する工程を説明するための模式的側面図である。

[図4]図3の矢印IVから見たホルダー及び遮蔽部材の模式図である。図4においては、遮蔽部材が設けられている領域にハッチングを附している。

[図5]実施例1～3及び比較例のそれぞれにおける L_5 と、 T_1/T_2 との関係を表すグラフである。

発明を実施するための形態

[0009] 以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、以下の実施形態は単なる例示である。本発明は、以下の実施形態に何ら限定されない。

[0010] また、実施形態等において参照する各図面において、実質的に同一の機能を有する部材は同一の符号で参照することとする。また、実施形態等において参照する図面は、模式的に記載されたものである。図面に描画された物体の寸法の比率などは、現実の物体の寸法の比率などとは異なる場合がある。図面相互間においても、物体の寸法比率等が異なる場合がある。具体的な物体の寸法比率等は、以下の説明を参酌して判断されるべきである。

- [0011] まず、図1及び図2を参照しながら本実施形態において製造する太陽電池1の構成について説明する。
- [0012] 太陽電池1は、板状の基体10を備えている。基体10は、受光することによって電子や正孔などのキャリアを生成する部分を含むものである限りにおいて特に限定されない。基体10は、例えば、一の導電性を有する結晶性半導体基板を有するものであってもよい。また、基体10は、一の導電性を有する結晶性半導体基板と、結晶性半導体基板の上に形成されており、他の導電性を有する第1の非晶質半導体層と、結晶性半導体基板の上に形成されており、一の導電性を有する第2の非晶質半導体層とを有するものであってもよい。また、基体10は、n型ドーパント拡散領域とp型ドーパント拡散領域とが表面に露出している半導体基板を有するものであってもよい。
- [0013] 基体10は、受光面10aと、裏面10bとを有する。裏面10bには、p型表面10bpと、n型表面10bnとが含まれている。p型表面10bpは、p型ドーパント拡散領域やp型の非晶質半導体層などにより構成されているp型領域の表面により構成されている。n型表面10bnは、n型ドーパント拡散領域やn型の非晶質半導体層などにより構成されているn型領域の表面により構成されている。
- [0014] 太陽電池1は、p型表面10bpの上に設けられたp側電極11pと、n型表面10bnの上に設けられたn側電極11nとを有する。p側電極11p及びn側電極11nのそれぞれは、互いに電氣的に分離された形状、例えばくし歯状にされている。
- [0015] p側電極11p及びn側電極11nのそれぞれは、シード層13と、めっき膜14とを有する。シード層13は、裏面10bの上に設けられている。このシード層13は、めっき膜14を形成する際のシードとして機能する層である。シード層13は、例えば、Cu、Al、Ag、Au、Pt、Ti、Niなどの金属や、これらの金属のうちの少なくとも一種を含む合金により形成することができる。シード層13の厚みは、特に限定されないが、例えば、20nm～500nm程度とすることができる。

- [0016] めっき膜 14 は、シード層 13 の上に形成されている。めっき膜 14 は、例えば、例えば、Cu, Al, Ag, Au, Pt, Sn, Ni などの金属や、これらの金属のうちの少なくとも一種を含む合金により形成することができる。めっき膜 14 の厚みは、特に限定されないが、例えば、 $2\mu\text{m}\sim 50\mu\text{m}$ 程度とすることができる。
- [0017] 次に太陽電池 1 の製造方法について、図 3 及び図 4 を参照して説明する。
- [0018] まず、裏面 10b に、p 型表面 10bp 及び n 型表面 10bn を有する基体 10 を複数用意する。なお、p 型表面 10bp 及び n 型表面 10bn の上にシード層 13 を設けたものを基体 10 としてもよい。シード層 13 の形成は、例えば、真空蒸着法やスパッタリング法などにより行うことができる。基体 10 の作製方法は特に限定されないが、基体 10 は、単結晶シリコン基板や多結晶シリコン基板等の結晶性半導体基板を用いて作製したものであることが好ましい。基体 10 は、例えば、公知の方法により形成することができる。
- [0019] 次に、p 型表面 10bp 及び n 型表面 10bn 上にめっき膜 14 を形成する。本実施形態においては、複数の基体 10 に対して同一の工程で同時にめっき膜 14 を形成する。具体的には、複数の基体 10 を、シード層 13 が形成された裏面 10b を露出させた状態でマトリクス状に固定可能なホルダー 20 を用いる。
- [0020] ここで、「マトリクス」とは、少なくともひとつの列と少なくともひとつの行とを有する配列を意味する。列と、行とは、垂直であってもよいし、傾斜していてもよい。すなわち、本発明において、マトリクスには、正方行列と斜方行列とが含まれる。また、マトリクスにおいて、行数と列数とは同じであってもよいし、異なってもよい。
- [0021] 次に、ホルダー 20 に、複数の基体 10 を、シード層 13 が形成された裏面 10b を露出させた状態でマトリクス状に固定する。この際に、隣り合う基体 10 間の距離 L_5 , L_8 (図 4 参照) が 30mm 以下となるように複数の基体 10 を固定する。なお、距離 L_5 と距離 L_8 とは、異なってもよ

いが、互いに等しいことが好ましい。

[0022] なお、本実施形態では、4行×4列の合計16個の基体10を固定する例について説明するが、本発明において、ホルダーに固定する基体の数量は特に限定されない。

[0023] 遮蔽部材22の外縁部の幅L4は、特に限定されないが、例えば、30mm～100mm程度とすることができる。

[0024] 次に、ホルダー20の前方に、ホルダー20に固定された複数の基体10に形成されたシード層13と対向するように、めっき用電極21を配置する。また、めっき用電極21とホルダー20との間に、めっき用電極21及びホルダー20と平行に額縁状の遮蔽部材22を配置する。遮蔽部材22を、方向zのz1側からz2側に向かって視た際に、少なくとも複数の基体10が設けられている領域の外側の領域を覆うように配置する。具体的には、本実施形態では、z1側からz2側に向かって視た際に、複数の基体10が配置されている領域の外縁部23を覆うように、遮蔽部材22を配置する。最外周に配置されている基体10の一部は、遮蔽部材22によって遮蔽される。このため、本実施形態においては、外縁部23の幅L3は、0より大きい。但し、本発明は、この構成に限定されない。本発明においては、複数の基体が設けられている領域を覆わないように遮蔽部材22を配置してもよいし、幅L3が0となるように遮蔽部材22を配置してもよい。

[0025] また、本実施形態では、遮蔽部材22を、ホルダー20の外縁部の全体が覆われるように配置する。なお、遮蔽部材22のホルダー20の外側に位置している部分の幅L6は、特に限定されない。

[0026] 方向zにおける遮蔽部材22と基体10の裏面10bまでの距離（詳細には、遮蔽部材22と裏面10bの上に形成されているシード層13の表面までの距離）L2は、特に限定されないが、例えば、10mm～80mm程度とすることができる。

[0027] 方向zにおけるめっき用電極21と基体10の裏面10bまでの距離（詳細には、めっき用電極21と裏面10bの上に形成されているシード層13

の表面までの距離) L_1 は、特に限定されないが、例えば、 $30\text{ mm} \sim 100\text{ mm}$ 程度とすることができる。距離 L_1 に対する距離 L_5 、 L_8 の比 (L_5/L_1 、 L_8/L_1) は、 0.4 以下であることが好ましく、 0.38 以下であることがより好ましく、 0.375 以下であることがさらに好ましい。

[0028] 遮蔽部材 22 の材質は、特に限定されないが、遮蔽部材 22 は、絶縁材料からなる絶縁部材であることが好ましい。絶縁材料の具体例としては、樹脂やセラミックスなどが挙げられる。

[0029] 次に、複数の基体 10 が固定されたホルダー 20、遮蔽部材 22 及びめっき用電極 21 を、上記位置関係を保持したまま、めっき浴 24 に浸漬する。めっき浴 24 の種類は、形成しようとするめっき膜 14 の種類に応じて適宜選択することができる。めっき膜 14 の側面と基体 10 との間の距離 L_7 は、特に限定されないが、例えば、 $50\text{ mm} \sim 150\text{ mm}$ 程度とすることができる。この距離 L_7 が小さすぎると、めっき液の供給が不足し、形成されるめっき膜 14 の膜厚むらが大きくなる場合がある。また、距離 L_7 が大きすぎても、めっき液が十分に攪拌されず、形成されるめっき膜 14 の膜厚むらが大きくなる場合がある。

[0030] 次に、めっき用電極 21 と基体 10 の上に形成されているシード層 13 との間に電圧を印加することにより、電解めっきを行い、めっき膜 14 を形成する。このめっき工程においては、ホルダー 20 を揺動させておくことが好ましい。また、めっき浴 24 を攪拌しておくことが好ましい。そうすることによって、めっき液の供給ばらつきを抑制できる。従って、小さな膜厚ばらつきでめっき膜 14 を形成することができる。

[0031] ところで、遮蔽部材を配置せずにめっき膜の形成を行った場合は、マトリクス状に配置された複数の基体 10 のうち、外側に配置されている基体 10 を通過する電気力線の本数が、中央側に配置されている基体 10 を通過する電気力線の本数よりも多くなる。よって、外側に配置されている基体 10 の上に形成されるめっき膜が相対的に厚くなり、中央側に配置されている基体

10の上に形成されるめっき膜が相対的に薄くなる。従って、形成されるめっき膜の厚みが、複数の太陽電池間でばらつく。

[0032] それに対して、本実施形態では、少なくとも複数の基体10が設けられている領域の外側を覆うように遮蔽部材22を配置した状態でめっき膜14を形成する。このため、めっき膜14の形成工程において、外側に配置されている基体10Aを通過する電気力線の本数を少なくすることができる。よって、外側に配置されている基体10Aと、中央側に配置されている基体10Bとで、通過する電気力線の本数の差を小さくなる。このため、基体10A、10B間で、形成されるめっき膜14の厚みむらを小さくすることができる。従って、太陽電池1を、小さな電極11p、11nの厚みばらつきで製造することができる。

[0033] 本実施形態では、z1側からz2側に向かって視た際に、複数の基体10が配置されている領域の外縁部23を覆うように、遮蔽部材22を配置する。このため、基体10Aを通過する電気力線の本数をより少なくすることができる。よって、外側に配置されている基体10Aと、中央側に配置されている基体10Bとの間の、通過する電気力線の本数の差をより小さくなる。このため、基体10A、10B間で、形成されるめっき膜14の厚みむらをより小さくすることができる。従って、太陽電池1を、より小さな電極11p、11nの厚みばらつきで製造することができる。

[0034] なお、形成されるめっき膜14の厚みむらをより小さくする観点からは、距離L3が0以上であることが好ましく、0より大きいことがより好ましく、10mmより大きいことがさらに好ましく、20mmより大きいことがなお好ましい。

[0035] また、本実施形態では、隣り合う基体10間の距離L5、L8が30mm以下である。距離L1に対する距離L5、L8の比($L5/L1$, $L8/L1$)は、0.4以下である。このように、本実施形態では、距離L5、L8が小さくされている。このため、基体10A、10B間で、形成されるめっき膜14の厚みむらをさらに小さくすることができる。従って、太陽電池1

を、さらに小さな電極 11 p、11 n の厚みばらつきで製造することができる。なお、距離 L5、L8 を小さくすることによって形成されるめっき膜 14 の厚みむらを小さくできるのは、基体 10 A、10 B の端縁部を通過する電気力線の密度を小さくできるためであると考えられる。

[0036] 以下、本発明について、具体的な実施例に基づいて、さらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲において適宜変更して実施することが可能である。

[0037] (実施例 1～3) 上記実施形態に係る方法により、下記の表 1 に示す条件で、Cu からなるめっき膜を形成した。なお、L7 は、70 mm とした。L1 は、80 mm とした。

[0038] そして、外側に配置された基体 10 A の上に形成されためっき膜 14 のうち、中心に最も近い部分の厚み (T_1) と、中央側に配置された基体 10 B の上に形成されためっき膜 14 のうち、中心に最も近い部分の厚み (T_2) とを測定し、 T_1/T_2 を算出した。結果を下記の表 1 に示す。また、各実施例 1～3 における距離 L5 と T_1/T_2 との関係を図 5 に示す。

[0039] (比較例) 遮蔽部材を用いなかったこと以外は、上記実施例 1～3 と同様に、下記の表 1 に示す条件でめっき膜を形成し、 T_1/T_2 を算出した。結果を下記の表 1 に示す。また、本比較例における距離 L5 と T_1/T_2 との関係を図 5 に示す。

[0040]

[表1]

	条件	遮蔽部材	L2 (mm)	L3 (mm)	L5(=L8) (mm)	$L5/L1$ (= $L8/L1$)	T_1/T_2 (%)
実施例1	1	有	30	20	40	0.50	180
	2				35	0.44	175
	3				30	0.38	140
	4				25	0.31	135
	5				20	0.25	130
	6				15	0.19	125
実施例2	1	有	30	40	40	0.50	170
	2				35	0.44	165
	3				30	0.38	130
	4				25	0.31	120
	5				20	0.25	115
	6				15	0.19	115
実施例3	1	有	30	60	40	0.50	170
	2				35	0.44	165
	3				30	0.38	140
	4				25	0.31	130
	5				20	0.25	120
	6				15	0.19	120
比較例	1	無	30		40	0.50	450
	2				35	0.44	400
	3				30	0.38	250
	4				25	0.31	220
	5				20	0.25	200
	6				15	0.19	200

[0041] 上記表1及び図5に示す結果から、少なくとも複数の基体10が設けられている領域の外側を覆うように遮蔽部材を配置した状態でめっき膜を形成することにより、形成されるめっき膜の膜厚ばらつきを小さくできることが分かる。

[0042] また、隣り合う基体間の距離を30mm以下、距離L1に対する距離L5、L8の比($L5/L1$ 、 $L8/L1$)を0.38以下にすることにより、形成されるめっき膜のばらつきをさらに小さくできることが分かる。

符号の説明

[0043] 1…太陽電池

10…基体

1 0 a … 受光面

1 0 b … 裏面

1 0 b n … n 型表面

1 0 b p … p 型表面

1 1 n … n 側電極

1 1 p … p 側電極

1 3 … シード層

1 4 … めっき膜

2 0 … ホルダー

2 1 … めっき用電極

2 2 … 遮蔽部材

2 3 … 外縁部

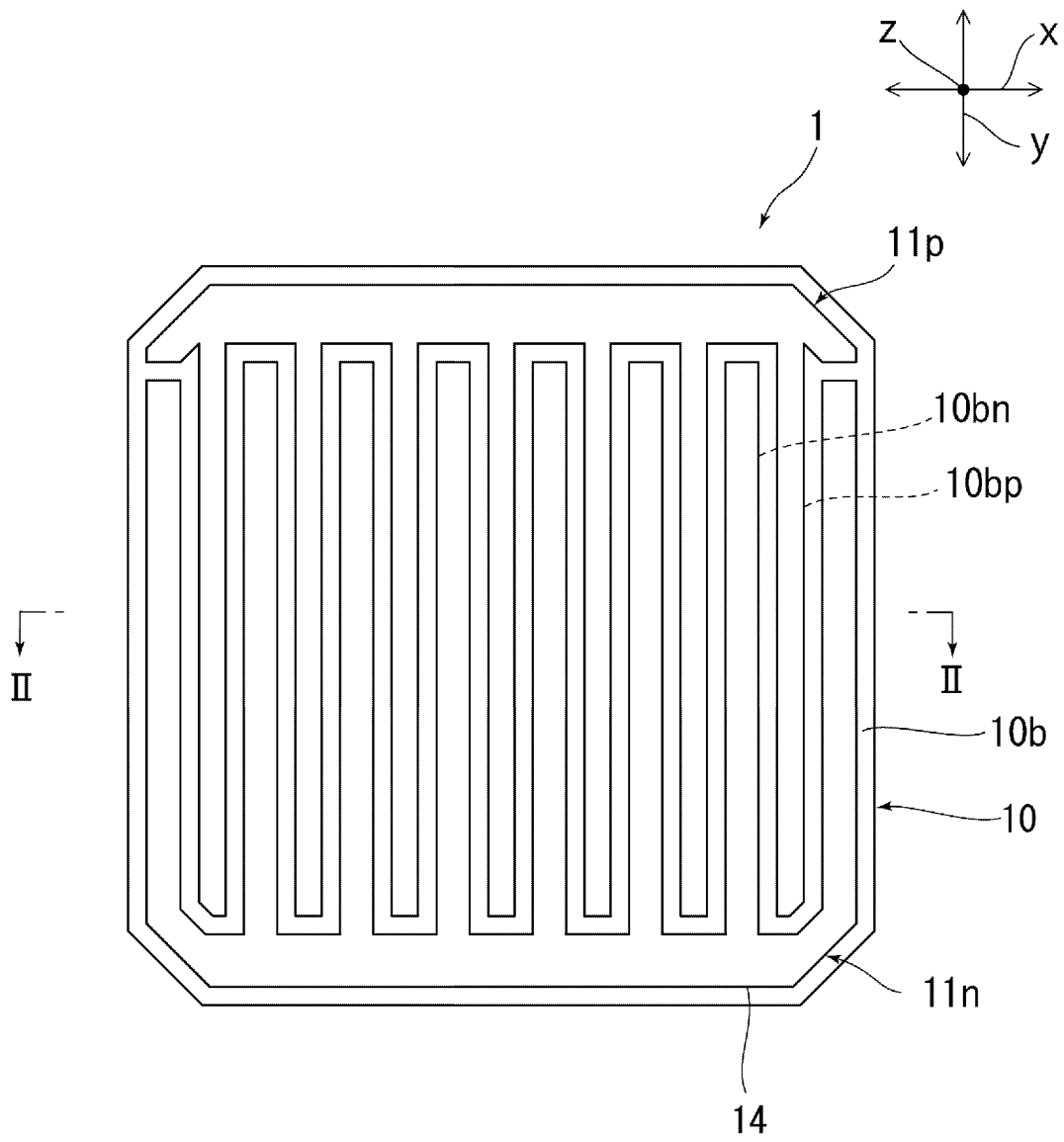
2 4 … めっき浴

請求の範囲

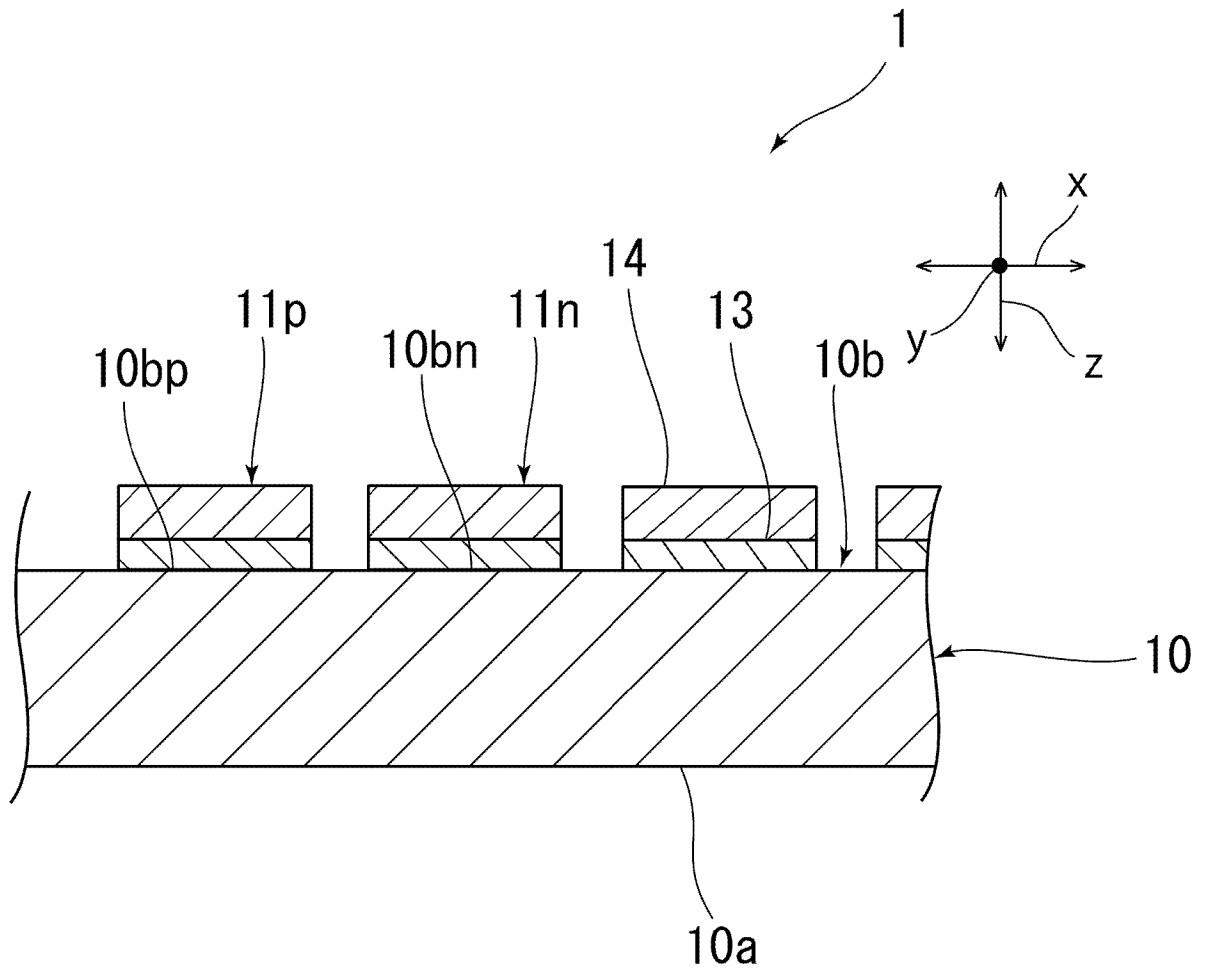
- [請求項1] めっき浴中において、複数の基体がマトリクス状に支持されたホルダーをめっき用電極に対向させて配置すると共に、前記ホルダーと前記めっき用電極との間に少なくとも前記複数の基体が配置されている領域の外側の領域を覆うように遮蔽部材を配置し、前記複数の基体上にめっき膜を形成する工程を備える、太陽電池の製造方法。
- [請求項2] 請求項1に記載の太陽電池の製造方法であって、
前記複数の基体が配置されている領域の外縁部を覆うように前記遮蔽部材を配置した状態で、前記めっき膜を形成する。
- [請求項3] 請求項1または2に記載の太陽電池の製造方法であって、
隣り合う前記基体間の距離を30mm以下とする。
- [請求項4] 請求項1～3のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法であって、
、
隣り合う前記基体間の距離の前記めっき用電極と前記基体の一の主面との間の距離に対する比（（隣り合う基体間の距離）／（めっき用電極と基体の一の主面との間の距離））を0.4以下とする。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法であって、
、
前記遮蔽部材として、絶縁部材を用いる。
- [請求項6] 請求項1～5のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法であって、
、
前記ホルダーを揺動させながら前記めっき膜を形成する。
- [請求項7] 請求項1～6のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法であって、
、
前記めっき浴を攪拌しながら前記めっき膜を形成する。
- [請求項8] 請求項1～7のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法であって、
、
前記複数の基体上に同時にめっき膜を形成する。

BLANK PAGE RECEIVED AT IB

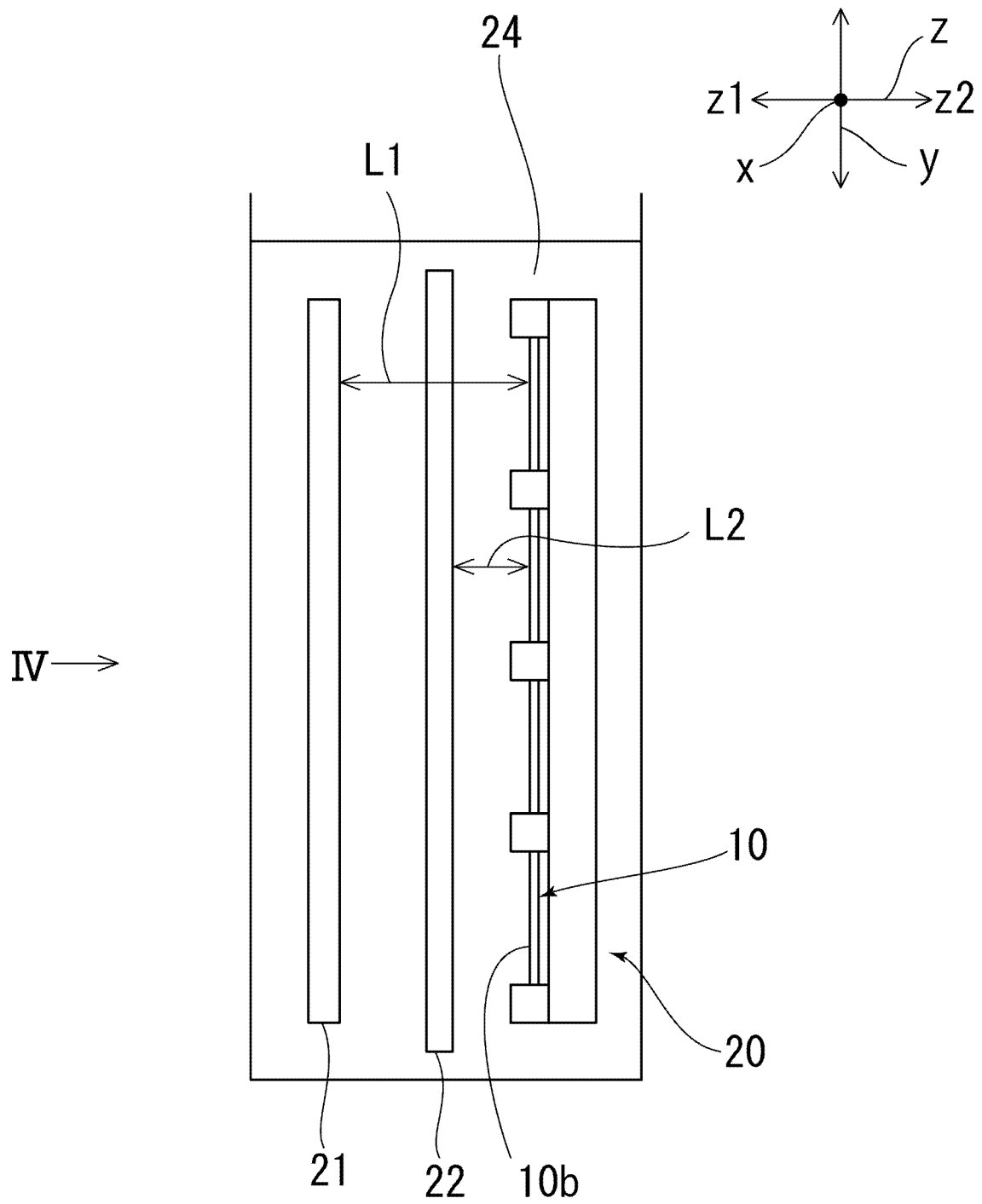
[図1]



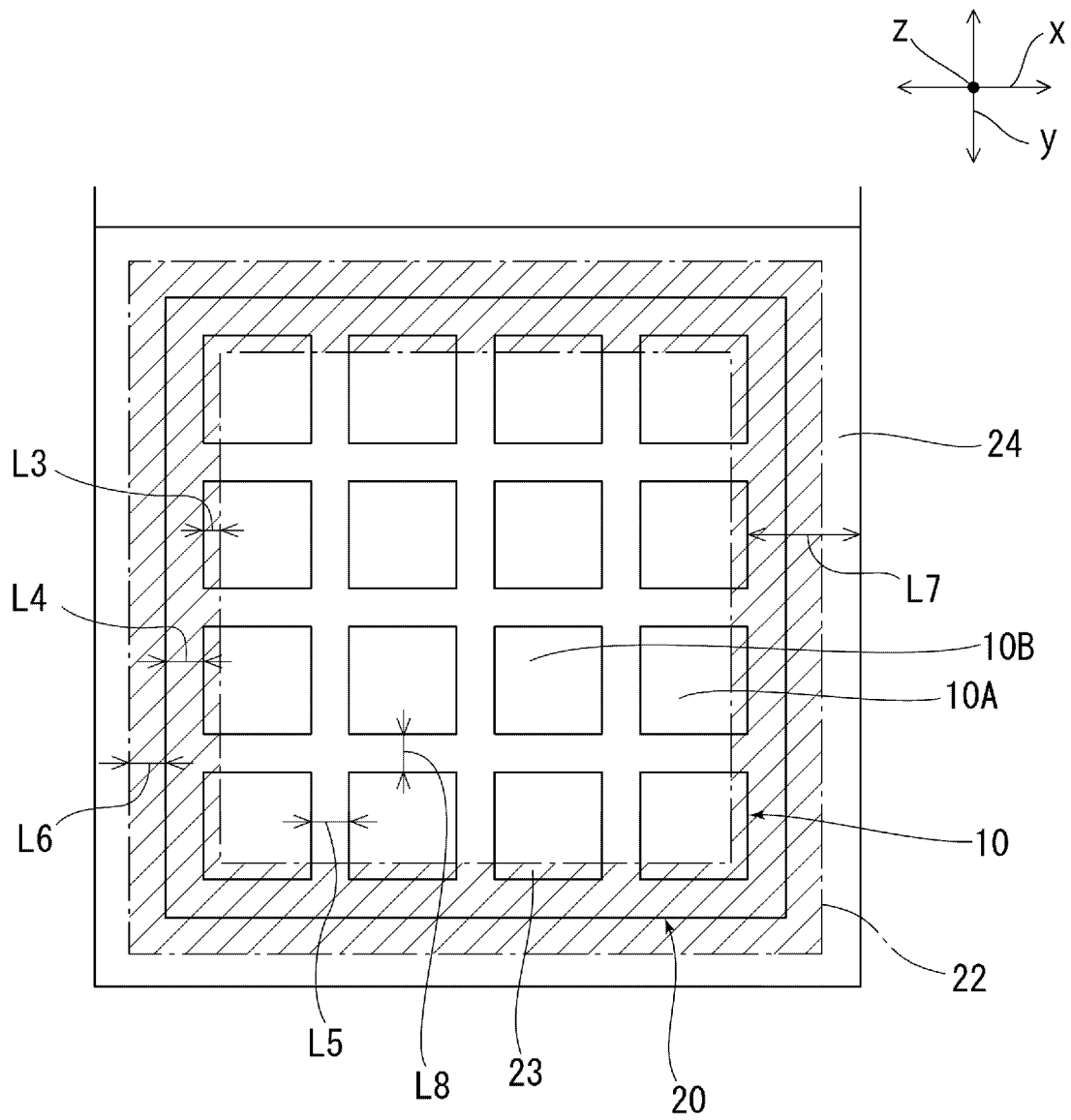
[図2]



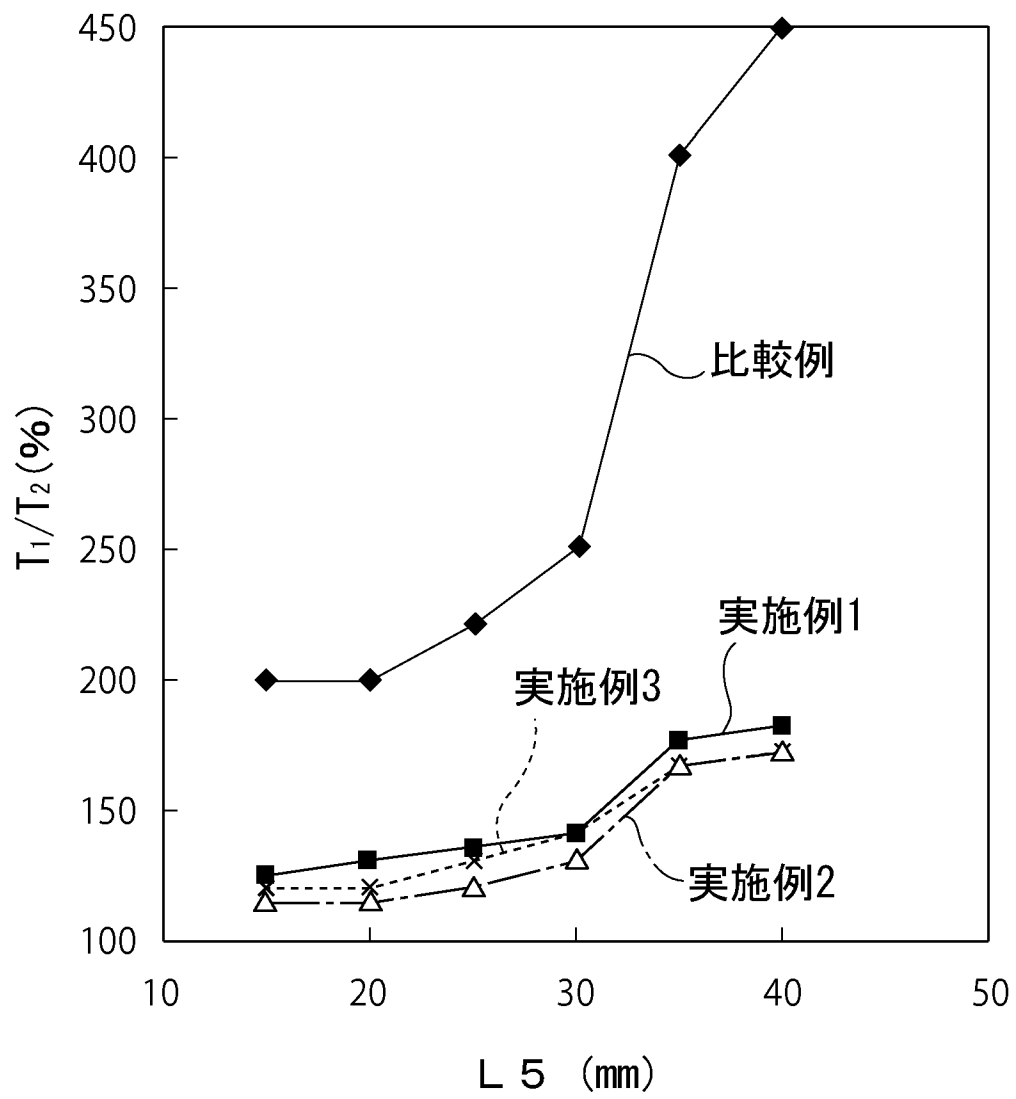
[図3]



[図4]



[図5]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/072178

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01L31/04 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01L31/04-31/078, 51/42, C25D1/00-3/66

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2011
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2011	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2011

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2000-294819 A (Sharp Corp.), 20 October 2000 (20.10.2000), paragraphs [0003] to [0007], [0015], [0023], [0032]; fig. 2, 9 (Family: none)	1-8
Y	WO 2005/029540 A2 (SUNPOWER CORP.), 31 March 2005 (31.03.2005), paragraphs [0002], [0003], [0006], [0013], [0018] & US 2005/0061665 A1	1-8
Y	JP 2009-149979 A (Mitsubishi Materials Corp.), 09 July 2009 (09.07.2009), paragraphs [0012], [0031]; fig. 2 (Family: none)	6, 7

☐

Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

05 December, 2011 (05.12.11)

Date of mailing of the international search report

13 December, 2011 (13.12.11)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. H01L31/04(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. H01L31/04-31/078, 51/42,
C25D1/00-3/66

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 1 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 1 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 1 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2000-294819 A (シャープ株式会社) 2000. 10. 20, 【0003】 - 【0007】 , 【0015】 , 【0023】 , 【0032】 , 【図 2】 , 【図 9】 (ファミリーなし)	1-8
Y	WO 2005/029540 A2 (SUNPOWER CORPORATION) 2005. 03. 31, [0002], [0003], [0006], [0013], [0018] & US 2005/0061665 A1	1-8
Y	JP 2009-149979 A (三菱マテリアル株式会社) 2009. 07. 09, 【0012】 , 【0031】 , 【図 2】 (ファミリーなし)	6, 7

C 欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 5 . 1 2 . 2 0 1 1

国際調査報告の発送日

1 3 . 1 2 . 2 0 1 1

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官 (権限のある職員)

井上 徹

2 K

3 6 0 7

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 5 5